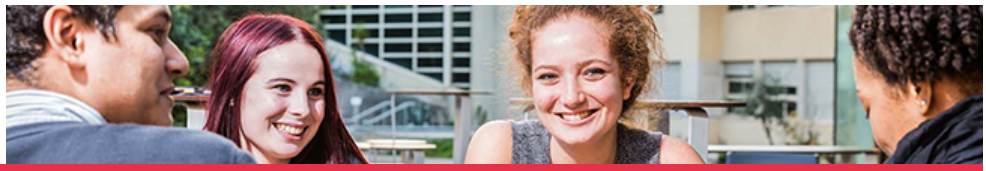

Test et Fiabilité des Circuits et Systèmes Intégrés

ECTS
5 crédits

Composante
Faculté des Sciences

Présentation

Description

* Test des circuits intégrés numériques.
* Modèles de fautes.
* Génération de vecteurs de test.
* Conception pour le test (DFT).
* Test intégré autonome (BIST).
* Test des Circuits Intégrés Analogiques.
* Test industriel (tests fonctionnels et paramétriques, caractérisation).

Objectifs

Savoir appréhender les problèmes liés au test industriel des circuits et systèmes intégrés ainsi que les méthodes permettant de réduire les coûts de ce test (génération de vecteurs, conception en vue du test, …). Appréhender les techniques de caractérisation et savoir déterminer les marges de fonctionnement et de performances de circuits intégrés numériques

Pré-requis nécessaires

Connaissances en électroniques analogiques et numériques

Syllabus

Essentials of Electronic Testing, M.L. Bushnell et V.D. Agrawal, Kluwer Academic Publishers

Informations complémentaires

CM : 21h

TP : 21h

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Arnaud VIRAZEL

arnaud.virazel@umontpellier.fr

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 13 mars 2023